

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 7, 2008

Влияние неровностей краев субмикронных отверстий на дифракцию света <i>Н. Н. Салащенко, М. Н. Торопов, Н. И. Чхало</i>	3
Влияние атомов бора на свойства квантовых точек InAs в матрице GaAs <i>В. М. Данильцев, Н. В. Востоков, Ю. Н. Дроздов, М. Н. Дроздов, А. В. Мурель, Д. А. Пряхин, О. И. Хрыкин, В. И. Шашкин</i>	6
Исследование радиационных нарушений в монокристаллах кварца, облученных протонами <i>В. И. Графутин, А. Г. Залужный, С. П. Тимошенко, О. М. Бритков, О. В. Илюхина, Г. Г. Мясищева, Е. П. Прокопьев, Ю. В. Фунтиков</i>	10
Спектральные калибровки фильтров и детекторов солнечного телескопа на диапазон 13.2 нм проекта ТЕСИС <i>С. В. Кузин, С. В. Шестов, А. А. Перцов, А. А. Рева, С. Ю. Зуев, А. Я. Лопатин, В. И. Лучин, Х. Жоу, Т. Хуо</i>	19
Оптические свойства инверсных двумерных фотонных структур при разупорядочении их элементарной ячейки <i>М. Ю. Барабаненков</i>	24
Исследование пьезоэлектрического эффекта в кристалле танталата лития методом высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии <i>Д. В. Иржак, Д. В. Пунегов, Д. В. Роцупкин</i>	28
Электромагнитная индуцированная прозрачность магнитных нанокластеров в поле двухчастотной накачки <i>Г. А. Вугальтер, А. В. Швецов</i>	32
Анализ тонких слоев магнитных полупроводников на основе Ge:Mn методами рентгеновской фотоэлектронной и оже-спектроскопии <i>Е. С. Демидов, С. Ю. Зубков, В. П. Лесников, Г. А. Максимов, Д. Е. Николитчев, В. В. Подольский</i>	36
Характеризация периодических доменных структур в кристаллах ниобата лития методами растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифракции <i>Л. С. Коханчик, Д. В. Иржак, В. В. Антипов</i>	41
О возможности синтеза одномерного углерода при радиационной карбонизации ПВДФ <i>С. С. Чеботарев, Л. А. Песин, И. В. Грибов, Н. А. Москвина, В. Л. Кузнецов, С. Е. Евсюков</i>	49
Резонансное рассеяние рентгеновского излучения в магнитных кристаллах с некубической локальной анизотропией <i>А. А. Антоненко, Е. Н. Овчинникова, В. Е. Дмитриенко, С. П. Коллинз</i>	56
Флуоресцентный анализ мультислойной структуры $Zr(10\text{ нм})/[Fe(1.6\text{ нм})/Cr(1.7\text{ нм})]_{26}/Cr(50\text{ нм})/\text{стекло}$ в скользящей геометрии <i>М. А. Андреева, Е. Е. Одицова, В. Г. Семенов, С. М. Иркаев, В. В. Панчук</i>	60
Дифракция на отверстиях и последующее распространение в пространстве рентгеновского излучения с двумерно-ограниченным волновым фронтом <i>А. П. Орешко</i>	66
Численное моделирование спектра рентгеновского естественного кругового дихроизма в кристалле $CsCuCl_3$ <i>К. А. Козловская, Е. Н. Овчинникова, В. Е. Дмитриенко, А. Роголев</i>	70
Эмиссия фотонов при бомбардировке рубина ионами и электронами средних энергий <i>А. П. Яльч, И. Е. Митропольский, В. С. Буксар, Л. М. Маркович, С. С. Поп</i>	74
Влияние потенциала смещения на структуру и состав тонких пленок дихлоридов тантала и гафния, полученных методом ВЧ-магнетронного распыления <i>А. И. Бажин, А. А. Гончаров, В. А. Коновалов, В. А. Ступак</i>	79
Структурные особенности природного кварца по данным масс-спектрометрии вторичных ионов <i>П. И. Диденко</i>	83
Масс-спектрометрия вторичных нейтральных частиц (обзор) <i>В. А. Батулин, С. А. Еремин</i>	87
Новое уравнение для определения средних топологических характеристик межфазной поверхности в гетерогенных средах <i>В. П. Бушланов, И. В. Бушланов</i>	108

Contents

No. 7, 2008

Simultaneous English language translation of the journal is available from Pleiades Publishing, Ltd.

Distributed worldwide by Springer. *Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques* ISSN 1027-4510

Influence of the Pinhole Roughness on Light Diffraction <i>N. N. Salashchenko, M. N. Toropov, N. I. Chkhalo</i>	3
Effect of Boron Atoms Incorporation on Properties of InAs Quantum Dots in GaAs Matrix <i>V. M. Danil' tsev, N. V. Vostokov, Yu. N. Drozdov, M. N. Drozdov, A. V. Murel, D. A. Pryakhin, O. I. Khrykin, V. I. Shashkin</i>	6
Research of Radiation Damage of Quartz Single Crystals Irradiated by Protons <i>V. I. Grafutin, A. G. Zaluzhnyi, S. P. Timoshenkov, O. M. Britkov, O. V. Ilyukhina, G. G. Myasishcheva, E. P. Prokop'ev, Yu. V. Funtikov</i>	10
Spectral Calibration of Filters and Detectors of Solar EUV Telescope for 13.2 nm for the TESIS Experiment <i>S. V. Kuzin, S. V. Shestov, A. A. Pertsov, A. A. Reva, S. Yu. Zuev, A. Ya. Lopatin, V. I. Luchin, H. Zhou, T. Huo</i>	19
Optical Properties of Two-Dimensional Inverse Photonic Structures with Disordered Unit Cell <i>M. Yu. Barabanenkov</i>	24
Investigation of Piezoelectric Effect in LiTaO ₃ Crystal Using High-Resolution X-Ray Diffractometry <i>D. V. Irzhak, D. V. Punegov, D. V. Roshchupkin</i>	28
Electromagnetically Induced Transparency of Magnetic Nanoclusters Placed in a Double Pumping Field <i>G. A. Vugalter, A. V. Shvetsov</i>	32
Analysis of Magnetic Semiconductor Thin Layers Based on Ge:Mn by X-Ray Photoelectron and Auger Spectroscopy <i>E. S. Demidov, S. Yu. Zubkov, V. P. Lesnikov, G. A. Maximov, D. E. Nikolitchev, V. V. Podol'skii</i>	36
Characterization of Periodically Poled Domain Structures in Lithium Niobate Crystals by Scanning Electron Microscopy and X-Ray Diffraction <i>L. S. Kokhanchik, D. V. Irzhak, V. V. Antipov</i>	41
About Possibility of One-Dimensional Carbon Synthesis Via Radiative Carbonization of PVDF Surface <i>S. S. Chebotaryov, L. A. Pesin, I. V. Gribov, N. A. Moskvina, V. L. Kuznetsov, S. E. Evsyukov</i>	49
Resonant X-Ray Scattering in Magnetic Crystals with Noncubic Local Symmetry <i>A. A. Antonenko, E. N. Ovchinnikova, V. E. Dmitrienko, S. P. Collins</i>	56
X-Ray Fluorescence Analysis of Multilayer Zr(10 nm)/[Fe(1.6 nm)/Cr(1.7 nm)] ₂₆ /Cr(50 nm)/Glass Structure at Grazing Incidence Reflection <i>M. A. Andreeva, E. E. Odintsova, V. G. Semenov, S. M. Irkaev, V. V. Panchuk</i>	60
Diffraction on the Aperture and the Subsequent Space Distribution of X-Rays with the Two-Dimensional Limited Wavefront <i>A. P. Oreshko</i>	66
Numerical Modeling of X-Ray Natural Circular Dichroism in CsCuCl ₃ Crystal <i>K. A. Kozlovskaya, E. N. Ovchinnikova, V. E. Dmitrienko, A. Rogalev</i>	70
The Emission of Photons at Bombardment of Ruby by Ions and Electrons of Middle Energies <i>A. P. Yalch, I. E. Mitropolskii, V. S. Buksar, L. M. Markovich, S. S. Pop</i>	74
Effect of Bias Voltage on Structure and Phase Composition of Tantalum and Hafnium Thin Films Deposited by RF-Magnetron Sputtering <i>A. I. Bazhin, A. A. Goncharov, V. A. Konovalov, V. A. Stupak</i>	79
Structural Features of Natural Quartz on Secondary Ions Mass Spectrometry Data <i>P. I. Didenko</i>	83
Secondary Mass Spectrometry of Neutral Particles (A Review) <i>V. A. Baturin, S. A. Yeryomin</i>	87
New Equation for Definition of Average Topological Characteristics of Interphase Surface in Heterogeneous Environments <i>V. P. Bushlanov, I. V. Bushlanov</i>	108
